## 第27章 バウンダリスキャン仕様

## 27.1 パウンダリスキャン対象端子

外部端子のバウンダリスキャン(B-SCAN)の<u>対象に関しては、2.2 端子機能一覧「表 2-3 ユーザ端子一覧」</u> ~ <u>「表 2-17 電源/GND 端子一覧」を参照してください。</u>

削除: 付加

削除: 有無

削除: を以下に記載します。

**書式変更**: フォント : 太字

書式変更: フォント : 太字

**書式変更**: フォント : 太字 **書式変更**: フォント : 太字

**削除: <#>ユーザ (Servo) 端子一覧 1/3.** 表 **27-1**. ユーザ(Servo)端子一覧1/3.

来早

**書式変更**: 本文

## 27.2 B-SCAN モード引き込みシーケンス

以下にバウンダリスキャンモードの引き込みシーケンスを図で説明します。

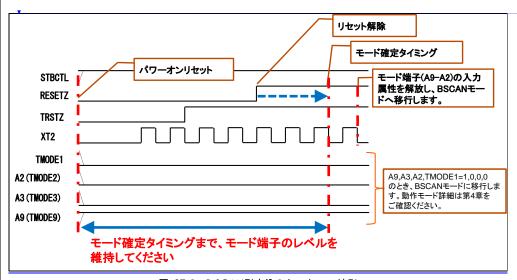


図 27-1 B-SCAN引き込みシーケンス波形

注動作モードが ASIC ベンダモード(A[3:2]=2'b00 かつ TMODE1=1'b0) かつ A[9]=1'b1 の場合に、B-SCAN モードに引き込みます。

B-SCAN モード<u>移行</u>後、BSDL ファイルを実行してください。

**削除:** 立ち上がり